

DICHIARAZIONE DI UNICITA'

Ex art. 63 del D.lgs 50/2016

OGGETTO: Richiesta di acquisto di *Microscopio Ottico in Super Risoluzione Lattice SIM dotato di 4 laser su stativo rovesciato* (ZEISS Elyra7 su Axio Observer 7).

Il sottoscritto Giuseppe Gigli, in qualità di responsabile del GAE P0000076, e Loretta Laureana del Mercato, in qualità di richiedente la fornitura in oggetto,

DICHIARA CHE

nell'ambito del progetto "TECNOMED"- Tecnopolo di nanotecnologia e Fotonica per la medicina di precisione, si rende necessaria la fornitura di un Microscopio Ottico per imaging in Super Risoluzione. La strumentazione deve essere in grado di combinare simultaneamente super-risoluzione, velocità e qualità di immagine sia su campioni fissati sia in live-imaging, ed essere comprensiva di meccanismi che consentano sia l'acquisizione ad elevata sensibilità ed elevata risoluzione di preparati a basso ingrandimento, sia l'acquisizione di immagini in super-risoluzione con elevata velocità di acquisizione, basse potenze laser ed elevata sensibilità in fluorescenza al fine di non danneggiare il campione, senza però sacrificare il potere di penetrazione all'interno del volume del campione stesso. La tecnologia richiesta deve essere compatibile con metodi standard di preparazione del campione e consentire l'uso di un'ampia gamma di fluorocromi classici che spazino dal vicino ultravioletto fino al rosso lontano, senza che si renda necessario l'uso di composti per limitare i danni da esposizione a laser o limitare lo stato di tripletto.

L'unico strumento che soddisfa tutte le caratteristiche sopra elencate è il sistema Elyra7 su Axio Observer 7, con Lattice SIM e 4 sorgenti laser risulta essere esclusiva produzione a livello internazionale della Carl Zeiss GmbH, commercializzata in esclusiva sul territorio italiano dalla Carl Zeiss S.p.A.

Ragione Sociale - Carl Zeiss S.p.A. - C.F./P.IVA n. 00721920 – Via Varesina 162 Milano – contatti (carlzeiss@pec.it);

per le seguenti motivazioni:

- o ragioni tecniche (c.2 lett. b.2);

Per l'attrezzatura indicata le ragioni tecniche da considerarsi motivo di infungibilità sono quelle riportate di seguito:

- Illuminazione in modalità Lattice SIM: Structured Illumination Microscopy senza utilizzo di pattern a griglia ma con un pattern di illuminazione a spot/reticolo, controllato ad elevate frequenze. Risoluzione sull'immagine: xy 120 nm, z 300 nm (riferimento nel verde).
- Imaging 2D: velocità di acquisizione fino a 255 fps, ottenibile per acquisizioni ultra-fast time lapse 2D @512x512 pixel e 1ms di esposizione. Risoluzione almeno 120 nm xy (riferimento nel verde).
- Imaging volumetrico: velocità di acquisizione fino a 51 fps, ottenibile per acquisizioni fast 3D @512x512 pixel e 1ms di esposizione. Risoluzione almeno 120 nm xy 300 z (riferimento nel verde).

Istituto di Nanotecnologia**Sede di Lecce**

c/o Campus Ecotekne

Via Monteroni – 73100 Lecce

☎ +39 0832 319702 – 319703

☎ +39 0832 319901

amministrazione.lecce@nanotec.cnr.it**Sede Secondaria Bari**

Via Amendola, 122/D

70126 Bari

☎ +39-080 5929501

☎ +39-080 5929520

amministrazione.bari@nanotec.cnr.it**Sede Secondaria Roma**

c/o Dip. di Fisica N.E.-Università Sapienza

Piazzale Aldo Moro, 5 00185 ROMA

☎ +39-06 49913720

☎ +39-06 49693308

amministrazione.roma@nanotec.cnr.it**Sede Secondaria Rende (CS)**

Ponte P. Bucci, Cubo 31/C

87036 Rende (CS)

☎ +39-0984 496008

☎ +39-0984 494401

amministrazione.rende@nanotec.cnr.it

- Possibilità di acquisire un campo di almeno 130x130 micron con risoluzione di almeno 170nm xy e 330nm z (riferimento nel verde) e 1ms esposizione, con obiettivo 40xoil e SIM 2D e 3D.
- Cambio automatico e ottimizzato del pattern di illuminazione, per obiettivo e lunghezza d'onda in uso. Tutti gli obiettivi richiesti sono utilizzabili per acquisizioni SIM.
- o diritti esclusivi, brevetti e marchi (c.2 lett. b.3);

Le suddette caratteristiche sono presenti nel microscopio Elyra7 e sono coperte dai brevetti elencati di seguito:

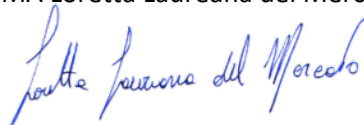
- US7609391 (B2)
- US7894136 (B2)
- US799061 (B2)

Si dichiara che quanto affermato corrisponde a verità e di essere a conoscenza della responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate in merito alla presente dichiarazione.

Luogo, 23/04/2020

IL RICHIEDENTE: NOME COGNOME

FIRMA Loretta Laureana del Mercato



IL RESPONSABILE DEL GAE: NOME COGNOME

FIRMA Giuseppe Gigli

Istituto di Nanotecnologia

Sede di Lecce

c/o Campus Ecotekne

Via Monteroni – 73100 Lecce

☎ +39 0832 319702 – 319703

☎ +39 0832 319901

amministrazione.lecce@nanotec.cnr.it

Sede Secondaria Bari

Via Amendola, 122/D

70126 Bari

☎ +39-080 5929501

☎ +39-080 5929520

amministrazione.bari@nanotec.cnr.it

Sede Secondaria Roma

c/o Dip. di Fisica N.E.-Università Sapienza

Piazzale Aldo Moro, 5 00185 ROMA

☎ +39-06 49913720

☎ +39-06 49693308

amministrazione.roma@nanotec.cnr.it

Sede Secondaria Rende (CS)

Ponte P. Bucci, Cubo 31/C

87036 Rende (CS)

☎ +39-0984 496008

☎ +39-0984 494401

amministrazione.rende@nanotec.cnr.it